

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/1749 della Commissione, del 7 ottobre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 421 del 14 dicembre 2020)

1. Pagina 142, allegato I, i punti 3B001.f.3 e il punto 3B001.f.4 sono sostituiti dai seguenti:
 - «3. apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio "laser"; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o
 2. non utilizzato;
 3. errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;
 4. apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fascio elettronico focalizzato deflesso; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o
 2. errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);»
2. Pagina 175, allegato I, i punti 6A002.a.1.b., 6A002.a.1.c. e 6A002.a.1.d. sono sostituiti dai seguenti:
 - «b. rivelatori a stato solido "qualificati per impiego spaziale" aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risposta di picco per lunghezze d'onda superiori a 900 nm, ma non superiori a 1 200 nm; e
 2. "costante di tempo" della risposta uguale o inferiore a 95 ns;
 - c. rivelatori a stato solido "qualificati per impiego spaziale" aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm ma non superiori a 30 000 nm;
 - d. "matrici sul piano focale" "qualificate per impiego spaziale" con oltre 2 048 elementi per matrice e aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm;»
3. Pagina 179, allegato I, i punti da 6A002.b à 6A002.f. sono sostituiti dai seguenti:
 - «b. "sensori di immagini monospettrali" e "sensori di immagini multispettrali" progettati per applicazioni di telerilevamento e aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. campo di visione istantaneo (IFOV) inferiore a 200 microradianti; o
 2. specificati per funzionare nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 30 000 nm e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. in grado di fornire un'uscita di dati di immagini in formato numerico, e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. "qualificati per impiego spaziale"; o
 2. progettati per impiego avionico, utilizzando rivelatori diversi dal silicio ed aventi un campo di visione istantaneo inferiore a 2,5 milliradianti;

Nota: 6A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione "sensori di immagini monospettrali" con risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm e che incorporano solo uno qualsiasi dei seguenti rivelatori non "qualificati per impiego spaziale" o "matrici sul piano focale" non "qualificate per impiego spaziale":

 1. dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD) non progettati o modificati per ottenere una 'moltiplicazione di carica'; o
 2. dispositivi a semiconduttori complementari a ossido metallico (CMOS) non progettati o modificati per ottenere una 'moltiplicazione di carica'.

